

令和 8 年 10 月 13 日

会員各位

一般社団法人 静岡県紙パルプ技術協会
工業技術研究所富士工業技術支援センター
工業技術研究所富士センター協議会

令和 8 年度第 2 回紙関連技術講演会開催のお知らせ

貴社ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。さて、令和 8 年度第 2 回紙関連技術講演会を下記により開催いたします。業務御多忙中のことと存じますが、多数御参加くださいますよう御案内申し上げます。

記

- 1 日 時 令和 8 年 11 月 25 日(水) 13:30～16:15
- 2 場 所 富士工業技術支援センター 1 階 大研修室（富士市末広 20 番地 6）
- 3 会 費 無 料
- 4 定 員 50 人
- 5 テーマ及び講師

(13:00～13:30) 受付

(13:30～13:35) 開会の挨拶

(13:35～14:20)

(1) テーマ：「有機フッ素化合物(PFAS)と水質汚濁防止法について」

講演者：富士市役所 環境保全課 水質担当主幹 下村 智宏 氏

要 旨： 社会的に関心が高まっている有機フッ素化合物(PFAS)について、県内だけでなく、全国的に指針値を超過する事例が散見されています。

環境省では、令和 7 年 5 月に「PFAS ハンドブック」を公表し、同年 12 月に更新するなど PFAS における管理を強化しています。同物資について、基礎的な知識や水質汚濁防止法上の扱いも絡めて、説明いたします。また、水質汚濁防止法について、具体的な事例を交えながら、同法の理解が進むよう解説いたします。

(14:20～15:05)

(2) テーマ：「赤外分光光度計と蛍光 X 線分析装置を用いた異物分析」

講演者：㈱島津製作所 分析計測事業部 西倉 瀬里 氏

要 旨： 製紙、食品、機械などのあらゆる製造業では、製品に混入・付着した異物の分析需要が高まっています。

異物分析には、有機物の分析に適した赤外分光光度計や無機物の分析に適した蛍光 X 線分析装置などが用いられます。また、装置ごとに得られる情報が異なるため、複数の装置を組み合わせることで、異物の多角的な評価が可能です。

本公演では、これら装置を用いた複合的な異物分析事例を紹介します。

(15:05～15:15) 休憩

(15:15～15:30)

(4) テーマ：「F T I R等機器分析を効果的に利用するには」

講演者：富士工業技術支援センター 製紙科長 田村 克浩

要 旨： F T I Rは、近年の機器及びA T R等アクセサリ一進歩より経験の少ない分析者でも、手軽に一定水準以上のスペクトルを得られるようになった。しかしF T I R等の機器分析は、紙の物性測定のように単に測定値が得られれば良いのではなく、スペクトル等の情報から物資を特定し、異物ならば混入源を特定し対策に結びつけることが真の目的である。講演では、この目的を達成するための依頼者の準備等を解説する。

(15:30～16:15)

(3) テーマ：「F T I Rを用いた異物分析のデモンストレーション」

講演者：(株)島津製作所 分析計測事業部 西倉 瀬里 氏

要 旨： フーリエ変換赤外分光光度計(F T I R)は、異物分析に広く用いられています。中でも、全反射(A T R)法は、簡便に測定できる手法として活用されています。A T R法による異物分析の前処理から測定、同定までの流れを、実演しながら説明します。

また、紙に付着した異物を含む、さまざまな異物を分析する際のテクニックも紹介します

6 申込方法

下記申込書内容をメール本文等に記入し、11月16日(月)までにお申込みください。
定員となり次第、締め切らせていただきます。

申込後に欠席等が生じる場合には、御連絡ください。

<申込先> 富士工業技術支援センター 製紙科

メールアドレス：fk-seishi@pref.shizuoka.lg.jp

お問合せ等電話番号：0545-35-5190

宛先：fk-seishi@pref.shizuoka.lg.jp（富工技製紙科）

令和8年11月25日(水)開催

令和8年度第2回紙関連技術講演会申込書

会 社 名

住 所 〒

参 加 者 氏 名	所 属 ・ 役 職 名	電 話 番 号